⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭63-132386

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)6月4日

G 06 K 9/00 G 06 F 15/62

460

6615-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全13頁)

の発明の名称

指紋照合方法

②特 頭 昭61-278698

愛出 願 昭61(1986)11月25日

⑫発 明 者

久保田

靖 夫

東京都江東区東陽2-3-1 423号

79発 明 者

小林

雄二

埼玉県上尾市大字瓦葺2716 尾山台団地3-7-203

②出 願 人 大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号

②代 理 人

弁理士 武 顕次郎

外1名

#### 明細質

## 1. 発明の名称

指紋照合方法

## 2. 特許請求の範囲

- (1) 予め登録してある指紋を裹わす登録指紋面像データと、検査すべき指紋の摄像により両者のよれた検査指紋画像データとの比較により両者の一致を調べる指紋照合方法において、上記画像のデータの一方の陸級部と他方の谷部とをそれぞれ心線として抽出する画像処理手段を設け、両画像データの重ね合わせにより両心線間に現われる交点の数に基いて上記両指紋の一致判定を行なうように構成したことを特徴とする指紋照合方法。
- (2)特許請求の範囲第1項において、上記一致 判定を、画像面での上記交点の分布密度が所定値 以下となつている領域の大きさにより行なうよう に構成したことを特徴とする指紋照合方法。
- (3)特許請求の範囲第1項において、上記交点の数を、上記心線同志で重なつて現われる画素の数によつて求めるように構成したことを特徴とす

る指紋照合方法。

- (4)特許請求の範囲第1項又は第3項において、 上記心線が4連結構成のデータとして抽出されて いることを特徴とする指紋照合方法。
- (5)特許請求の範囲第1項又は第3項において、 上記心線の一方が4連結構成のデータとして、他 方が8連結構成のデータとして、それぞれ抽出さ れていることを特徴とする指紋照合方法。
- (6) 特許請求の範囲第1項において、上記各画像データの取り込みが、撮像したデータの所定範囲内での無画素の個数が所定値以内に納まつたときに行なわれるように構成されていることを特徴とする指紋照合方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、画像データ処理によるパターン照合 に係り、特に、身元確認に好適な指紋照合方法に 関する。

〔從來技術〕

指紋照合の従来例としては、情報処理学会は、

## 特問昭63-132386 (2)

Vol 2 5. No. 6、 (1984. 6月号 P. 599 ~ P. 605) に記載されている例がある。

2 値化された指紋の酸線は細線化(骨格化)され心線(骨格パターン)とした後、特徴点(端点、分岐点)をテンプレートマツチングにより抽出し、その種類と位置を記録する。

抽出した特徴点は、誤検出による特徴点を除去 する修正処理を行つた後、真の特徴点として記録

Rs. R。のことであり、これを観特徴点に付随する特徴として考えるためのものである。

最終的に1つの特徴点に関しては、位置(x.y),方向d、リレーション(Ri,Rz,Rz,Rz,Rz)の情報が得られる。つまり1つの特徴点は(x.y,d,Rz,Rz,Rz,Rz,Rz,)で記述され、1つの指紋は、最終的にこれらの特徴点の記述の集り(約100個)で表現される。

次に、指紋照合サプシステムについて説明する。このサプシステムでの照合は、登録済みの指紋と、検査のため入力された指紋のそれぞれの特徴点を表わすデータ間での一致の度合を測るものであるが、具体的には、第18図に示すように、指紋全体の位置合わせを行う粗照合と、位置合わせ後、対の特徴点のデータに基いて一致の度合を測る精照合から成る。

相照合は、まず登録指紋(ファイル指紋)と検 査指紋(サーチ指紋)の"対"とすべき特徴点の 決定から始まる。ここで、特徴点については、第 19図に示すように、①親特徴点同志の方向差、 する。なお、修正処理の内容としては陰線の切れ によつて発生した端点や、陰線の小突起によつて 発生した分岐点の除去であり、具体的には、端点 の路線方向の近傍を調べ、対となるべき端点が存 在すれば路線の切れによる端点と判断し、 路線の 分岐したごく近傍に端点が存在すれば、 路線の小 突起によつて生じた分岐点および端点と判断する のである。

このようにして抽出、修正した特徴点は、第17 図に示すように、指紋の中心を原点とし、中心下 部の隆線の流れ方向をY軸とした座妻によりその 位置を記述する。

こうして、位置種類が記述された特徴点は、さらに第17図に示すように、特徴点間のリレーションと呼ばれる関連が調べられる。ここで、リレーションとは、ある特徴点(親特徴点)を中心とする局所座表系(強線方向をY軸とする)を設定し、各象限内で最も頂点に近い特徴点を1個づつ合計4個の子特徴点として選び、これらの点と親特徴点との間に存在するそれぞれの路線数R.R.

②4組の子特徴点の位置、方向リレーションの登、 のそれぞれについて調べ、それらが或る許容値以 内であれば"対"の候補とする。

次に、登録指数と検查指数とを、例えば角度を  $\Delta \Theta$  ( $\Delta \Theta = \pi / 3$  2) づつ、 1 5 種類ほど変化 させて重ね合わせ、それぞれの角度で"対"候補 の特徴点の位置の差

 $\triangle x = 1 x_1 - x_1 1$ 

 $\Delta y = 1 y_1 - y_2 1$ 

を計算し、第 2 0 図に示すように、 $\Delta$  x  $-\Delta$  y 平 而上に上記点 ( $\Delta$  x .  $\Delta$  y ) をプロットする。

このようにすると、ある回転角日のとき△× - △ y 平面上の (△ X . △ Y ) の位置を中心にプロットが密集する現象が起るが、このときの (△ X . △ Y ) 日が登録指紋と検査指紋の位置および角度の差である。

特照合は、上記の位置および角度差(△×・ △Y) Θを補正した後、再度"対"候補を調べ、 一致度の高い順に選択しなから指紋全体として矛盾のない"対"特徴点を選ぶ。このようにして選

## 特問四63-132386 (3)

ばれた"対"特徴点に対し位置差、方向差、隆線 数差を調べ、さらに子特徴点同志に関しても位置 差、方向差、隆線数差を調べ、指紋全体の特徴点 の一致の度合を総合し、最終的に指紋の一致の度 合として出力する。

ところで、以上述べて来た従来技術によれば、 確かに高精度な指紋照合を達成した反面、その分、 処理内容が複雑であり、実用化のために専用の高 速演算処理装置と大型汎用コンピュータを必要と した。

一方、現在、入室管理や取引管理に使用されている本人の確認方法としては、暗証番号によるものが一般的であるが、第三者に番号を知られた場合は無力であり、従つて、より確実な方法が望まれており、この為、指紋照合の適用が考えられる。

しかしながら、このような要望を満すためには、 端末装置程度の処理能力でも実時間処理可能な簡 易な指紋照合アルゴリズムの開発が必要である。

そこで、簡易な指紋照合アルゴリズムとして、 パターンマツチングによる照合が考えられる。な

を関する。そして、この指紋の読取りに良く用いられる方法としては、従来からプリズムの全反射を利用したものがある。なお、この方法は全反第21図(a)に示すように、直角プリズムの全反射面に指を押し当てると、陸級部だけがガラス出てしため、全反射すべき光が指の側に透過してしため、全反射方向から見ると、同図(b)が黒く見えることを利用したものである。

この方式は簡単にコントラストの良い指紋画像が得られるため良く用いられるのであるが、指紋はゴム状の弾性体であるため、押しつけ圧の強弱により降線がカラス面に接する太さが変化し、強られた画像の隆線の太さが変化する。 さらに押しつけた圧力の方向により指紋が変形し、 通常のパターンマッチングで行われているように、 角度、位置を合わせただけでは十分照合概差が小さくならない。

この理由を、以下、第22図によつて説明する。 この第22図にいて、(a), (b)は同一の お、このパターンマッチングによる方法は、例えば登録した指紋画像と検査する指紋画像の差の絶対値の総和、即ち照合誤差を取り、これがある"しきい値"より小さいとき、2つの画像、つまり指紋が一致したとするものである。

しかしながら、この方法では、画像同志の位置 スレや角度ズレがあつた場合には、照合誤差は小さくならず誤判定を起す。そこで、これをさける ため、通常一方の画像の角度、位置を少しづつ変 更して照合誤差を計算し、最小の照合誤差をうえ る角度、位置で2つの画像の角度、位置が一致したとし、その照合誤差がしきい値以下の場合、 者が同一であると判断するようにしている。

#### (発明が解決しようとする問題点)

このパターンマツチングによる従来例によれば、 アルゴリズムが単純でハード化が容易なため高速 化しやすいなどの利点を持ち、指紋の照合に一応 利用可能であるが、指紋画像の読取り方法と関連 して、次のような問題点を持つ。

即ち、まず、指紋照合のためには、指紋の撮像

指紋を押付け圧を変化させて採取した場合を示したもので、 (a) が通常の圧力でものを、 (b) が強い圧力でのものである。

なお、第22図 (() は、参考のため、異なつ た指紋でのパターンマッチング例を示したもので ある。

本発明の目的は、上記した従来例の問題点に充

特開昭63-132386(4)

分に対処でき、パターンマツチングにより容易に、 しかも確実に指紋照合が得られ、本人確認などに 簡単に適用可能な指紋照合方法を提供することに ある。

(問題点を解決するための手段)

この目的を達成するため、本発明は、以下のよ うにしたものである。

即ち、まず、上記従来例の問題点を整理すると、 下記の2点となる。

(1) 隆線の太さが圧力により変化し、照合誤差 が生じる。

(ロ) 路線のパターンが圧力の方向により変化し、 照合誤差が生じる。

上記したように、従来のパターンマッチングによる方法では、画像データ同志で直接差を取り、その差の絶対値の照合エリア内の総和を照合誤差としているため、上記(イ)、(ロ)の変形がそのまま照合誤差となつて現われてしまうのである。

そこで、本発明では、まず、第2図 (a) に示すように、指紋画像を2値化してから細線化し、

以下、本発明による指紋照合方法について、実施例により詳細に説明する。

まず、本発明の原理について、第4図により説 明する。

この第4図において、(a)は通常の圧力で採取した指紋画像、(b)は強い圧力が加えられた状態で採取した指紋画像をそれぞれ示しており、これは第19図の従来例の場合における(a)。(b)に対応したものである。

そして、本発明では、これら(a), (b) に示す指紋画像は、まず、同図(c), (d) に示すように、一方では谷部の紐線化による心線となり、他方では路線部の細線化による心線となつた上で、同図(e) に示すようにパターンマッチングされる。

ここで、この第4図の本発明の場合と、第22 図の従来例の場合とを比較してみると、まず、第 22図の(e)では、両パターンが一致している 中心部でも陸線幅が微妙に異り、照合誤差が発生 しているのに対して、第4図の(e)では細線化

ついで同図(b)に示すように、陸線部、又は谷郎の心線を抽出し、登録指紋谷部の心線と、検査指紋路部の心線との交点の数、又は登録指紋隆線部の心線と検査指紋谷部の心線との交点の数を肌合誤差とする事で上記(イ)(ロ)の問題を軽減することができるようにしたものである。 (作用)

(実施例)

されている為、中心分に交点は現われず、中心部 では照合誤差は等である。

さらに、この第4図(e)の指紋の周辺部では、 心線の4本目まで交点が無く、第19図の場合に 比較して照合誤差が小さい(ほぼ零)範囲が広つ ており、全体として本発明の場合のほうが変形等 に、強い事が判る。なお、第4図(1)は、参考 のため異つた指紋の場合を示したものである。

しかしながら、第4図の本発明の場合でも、さらに外側に到ると交点を生じ、やはり照合誤差が増大する。この事は、照合において、照合誤差を計算する領域(範囲)を変形の少い小領域に限定しなければならない事を示している。そして、このように照合領域を限定した場合には、その領域の大きさにより認識率が左右される。

つまり、照合領域を小さくした場合には、変形 の影響は受けにくいが、異つた指紋でも部分パク ーンが一致する確率が高くなり、誤認識を生じや すくなり、他方、照合領域を大きく収つた場合に は、変形の影響を受けやすくなり、同一指紋でも 異つた指紋と認識しやすくなる。

そこで、以下の本発明の実施例では、このような照合領域の設定に影響されにくい照合方法も提供している。即ち、照合を単に画像の絶対値の和又は交点数の和として求めるように可なを生せるのような問題を解決するため、このような問題を解決するため、又はでは、原合方式としているのでは、別の分布によりパターンの一致している領域の大きでが完定し、この一致領域の大きさが一定以上の場合を同一の指紋と判定する方式としているのである。

これを第4図(c)で説明すると、登録指紋画像と検査指紋画像が同一指紋の場合、位置合わせをし重ね合わせると、図のよう中心部では交点が 生せず、照合誤差はほぼ等となるが、周辺部では 指紋の変形の為位置関係がズレて交点を生じる。

この分布を模式的に示すと、第5図(a)のようになり、同図(c)に示す領域に対して同図 (d)に示すパターンを呈する。次に、異つた指 较画像を重ね合わせた場合には、交点は、位置と は無関係に各部に分散し、同一指紋のときのよう なパターンは見られない。この状態を第5図(b). (e) に模式的に示す。

従つて、交点の分布、つまり画像の一致している領域の大きさを調べ、この領域の大きさが一定値以上であれば同一指紋であり、一定値以下であれば異つた指紋と判断できることになり、以下の実施例では、この方式を採用している。

この方式では、あらかじめ変形を予測して照合 領域を決定する必要がなく、実用的な照合方式を 提供できる。なお、このような照合方式について は、交点の数の例で説明したが、もちろん単なる 画像の差の絶対値を評価の基準とした場合にも通 用できるのはいうまでもない。

以下、本発明の一実施例について、具体的に説 明を進めることにする。

第1図は本発明の一実施例で、全体は、指紋読取部1、信号処理部2、取込判定部3、心線抽出記憶部4、それに照合判定部5で構成されており、

以下、これらについて順次、説明する。

まず、指紋読取部1は、光源10、拡散板11、 プリズム12、摄像レンズ13、それにビデオカ メラ14などで構成されている。

光源10から出た光は拡散板11により均一な 拡散光にされた後、プリズム12内に入射する。 プリズム12は直角プリズムで構成されており、 このプリズム12に入射した光は、通常は45 \*. の全反射面により反射されてカメラ14にとどい ているが、プリズム12の全反射面に指下が押し 付けられると、その指紋の隆線が接している部分 では光が反射されなくなり、路線側へ透過してし まう。そこで、これをカメラ14側から見ると、 第18図 (b) に示すように、全反射面に酸線の パターンが黒く見える。このとき背影としては拡 **散板11が焦点の合わない状態で提像される。従** つて、拡散板11が無いと光源10が直接摄像さ れ、隘級の背彫として好ましくない。なお、この ようなプリズムを用いた方式を、ここでは直角プ リズム損像方式と呼ぶ。

こうして、プリズム 1 2 によつてコントラストが付けられた指紋パターンは、次に、カメラ 1 4 のレンズ 1 3 によつて摄像面(CCD等) 1 4 a に結像されるが、このとき、プリズム 1 2 の全反射面が光軸に対して傾斜しているため、レンズ13 の結像面も光軸に対して傾斜して現われる。

そこで、この実施例では、摄像面14aをこの 傾斜に合わせて設置することで、プリズム12の 全反射面、つまり、指紋を撮像すべき面の全体に わたつての焦点合わせを可能にするようになつて いるのである。

これを第6図により、さらに詳しく説明する。なお、この第6図は、優像用のレンズ13を、その直径方向を示す直線で表わしたもので、この図において、プリズム12の全反射面の中心〇を通った光は、焦点Fのレンズ13を通り〇、に結像する。これに対し、例えば全反射面上の点 Pから光についてみると、幾何光学に従えば、このP点からレンズ13の中心Lを通つた光はそのまま直進するが、Pから光軸と平行に出た光はレンズ

しで焦点Fを通る光に屈折させられ、前記のP点から出てレンズの中心Lを通る光とP 点で交差し、この点でP点の像を結ぶ。同様に、全反射面 FのQ点はQ 点に結像する。

このようにプリズム13の全反射面はP'O' C'を通る面で結像し、通常の光学系の場合とは 異つて、結像面は光軸と垂直にならない。

従つて単に光軸に垂直に撮像面を設けたのでは、 像がポケしいまうことになり、このため、上記実 施例では、摄像面14aを傾け、レンズ13によ る結像面と一致するように設けているのである。

しかしながら、この実施例では、プリズム12 の全反射面が光軸に対して傾いており、この結果、 摄像すべき指紋を斜め方向から見ることになつて しまうことによる画像ひずみの発生については、 無防備である。

そこで、このひずみの発生をなくすことができる光学系について第7図によつて説明する。

この第7図の光学系では、レンズ13をプリズム12の全反射面と平行になるように、即ち、レ

エーディング補正回路 2 1. 2 値化回路 2 2 などから構成されている。

ビデオカメラ14によつて指Fから読み込まれた指紋画像信号は、A/D変換器20により、4~8bie のデジタル信号に変換された後、シエージィング補正回路21による補正が加えられ、さらに2値化回路22によつて2値化れた後、画像メモリ(後述)に一旦、格納される。

ここでのシェーディング補正は、予め指紋の背景の明るさの分布を記憶しておき、この値から実際に入力した指紋画像の差を取る事により行なわれ、これにより明るさの分布を均一化し、二値化の際の誤差を軽減するために行なわれる。

また、 2 値化回路 2 2 による 2 値化は、上記シエーディング補正した画像((背景の明るさの分布) - (指紋画像))の値が一定のしきい値を越えた部分を黒画素として"1"に設定し、しきい値以下となつた部分を白画素として"0"に設定することにより行なう。

なお、他の実施例としては、上記したシエーデ

ンズ13の光軸がプリズム12の全反射面と直角になるように配置したもので、このようにすると、プリズム12の全反射面とレンズ13の面が平行になる為、結像面もプリズムの全反射面と平行となり、結果的に像のひずみが無くなる。第7回はこれを幾何光学的に示したもので、Pし:LP^、Oし:LO^。 の各比率がみな同一となつているのが判る。

次に、信号処理部では、A/D変換器での、シ

イング補正した後での2値化に限らず、浮動2値 化方式によつてもよい。

続いて、取込判定部3は、取込画像決定部30 と指紋画像メモリ31で構成されている。

プリズム12の全反射面に指下を押し付けたとき、その圧力や指先での発汗の状態により取込まれる指紋画像の陰線の湿液が変化し、極端な場合にはカスレによる陰線の途切れや、逆にツブレによる陰線の短絡などが生じ、誤判定の原因となる。従つて、取込み画像の良否を判定して指紋画像メモリに入力する必要がある。

取込画像決定部30はこのためのものであり、 あらかじめ決めた領域内の二値化された路線の面 積、つまり黒画素の総和が一定範囲内となった時、 良好な画像が得られたものとして指紋画像メモリ 31に記憶させる働きをする。つまり、カスレた 状態では黒画素数が少なく、ツブレた状態では黒 画素数が少なく、ツブレた状態では黒 画素数が少なく、ツブレた状態では 黒 質数が取込めるよう、取込画像設定部30での 許容範囲の上限および下限を決定すればよい。こ のようにすれば従来の画像隆線の温淡を直接検知 する方式に比べ、簡略な構成とすることができる。 さらに、心線抽出配便部4は、心線抽出部40 と心線画像メモリ41から構成されている。

心線抽出部40は指紋画像メモリ31から指紋 画像データを読み出し、第2図ないし第4図で説 明した、指紋の隆線部と谷部の細線化を行ない、 心線を抽出して心線画像データとし、それを心線 画像メモリ41に記憶させてゆく。

このとき、指紋の強級部では、画像データをそのままで、つまり、黒頭素を"1"としたままで上記の細線化処理を行えばよいが、谷部の細線化処理に際しては、黒画素"1"と白画素"0"について、"1"→"0", "0"→"1"と置き換えて細線化を行う必要がある。このように細線化したデータは二値画像として、上記したように、心線画像メモリ41に記憶される。

一方、新たに指紋を登録する場合にも、この心 線画像データが用いられるのであるが、このとき には、上紀心線画像の中から照合に必要な領域

まず、第9図(a)に示すように、粗照合用の、小領域をカバーするテンプレートを用い、これにより交点数を数えるのであるが、これを検査指紋画像中の候補領域全体に渡つて1画素づつ、順次位置をすらせて行ない、各位置における交点数、つまり照合誤差を計算する。そして、このようにして得た、照合と誤差が一定値以の部分に対して第9図(b)に示すように、カバー領域の大きな精照合用のテンプレートを用い、精照合を行なう。

このように、特照合に先立つて、まず、粗照合を行う事で、特照合を行なう位置を絞る事が出来、 従つて、この実施例によれば、データ処理量が節 約できる。又、粗照合自身は、テンプレートが小 さいため、デーク処理量が少くて済み、全体とし て効率の良い処理となる。

次に、照合判定部50による駅合判定処理について、第10図のフローチャートにより、さらに詳細に説明する。

なお、このフローチャートには記していないが、

(テンプレート)を選択し、それを指紋登録ファイル (後述) に記録するのである。なお、この照合を行う領域としては、通常、指紋の中心を含んだ領域を抽出するのが一般的であり、認識結果も比較的良好である。

ところで、ここにおける心線抽出は、上記した ように、指紋の変形に対する対策であるが、これ を具体的に実行するための方法としてはヒリディ ツチ(HILIDITICH)、村田等によつて 设塞されている各種のアルゴリズムを用いればよ い。しかして、これらはそれぞれ特徴を持つてい るが、詳しくは文献(田村、『細線化法について、 の指考察『電子通信学会研究会資料PRも75ー 66等)に開示があるので、ここではその詳しい 説明は省略する。

最後に、照合判定部5は、同名のプロツク50 と、指紋登録フアイル51とで構成されている。

ここで、この照合判定部50では、処理の高速化を図るため、第9図に示すように、根照合と精照合に分けて照合を行う。

まずテンプレートを作り、指紋登録ファイル 5 1 に指紋指定番号を付して記憶しておく。

このときのテンプレートは、例えば登録指紋の谷部を心線化し、心線化結果が第11図(a)に示すような8連結の場合は、同図(b)に示す鬼を残す心線の近傍で3方向へ拡大り同図(c)によりでない、これにより同図(c)にて記し、テンプレートとして記し、テンプレートとして記し、からに、8連結に変し、単純なandの次にある。に示すように、単純なあり、に示すように、単純なあり、に示すように、単純なあり、に示すように、単純なあり、に示すように、8連結とならandで検出である。

なお、以上のand操作では、まず、心線同志 の重なりとして現われる西素数が求まるが、これ を交点の数に変換するには、例えば、画像中の粒 子数(例えば赤血球の数)を数えるアルゴリズム を用いればよく、このような例としては、特別昭 51-41578号公報による「個数認識法」等 がある。しかし、交点の数と重なつて現われる画 素数とはほぼ比例しているから、交点の数を求め る代りに、簡単に求まる、上記した重なつて現わ れる画素数を用いるようにしてもよい。

第10図のフローチャートに戻り、この処理が 開始されると、まず、入力された検査指紋画像の 陸線部を心線化し照合判定部に読込み(S1、なお、Sはステツアを変わす)、次に、指紋指定番号に従い担照合用テンプレートを読込む(S2)。な第13図に示すような大きさのものを用いれば良いが、これは一実施例にすぎず、大きさ、形状等については、処理速度が向上するよう適宜くようしてやればよいことは言うまでもない。

次に、テンプレートと心線化した検査指収画像のandを取り、"l"となつた画素の数を額照合領域内で数え、交点画素数CNとする(S3)。

交点画素数が一定値TH」を越えた場合は、その位置での照合は一致しなかつたとし (S 4)、 照合位置を次の位置 (1 画素分) へずらし、 (S

この第15図において、中央の領域は粗照合で 用いた領域であり、特照合ではその周囲へ順次照 合領域を拡大してゆくようになつていることが判 る。

このように、以上の処理で一致領域の大きさが 求まるが、このとき、相照合のみで終つた場合は、 指紋は不一致である。一方、一致領域の大きさが ある程度以上の場合は、指紋は一致していると判 断出来るが、このときでの一致領域の大きさとし ては、判定に際して要求される照合精度に応じて しきい値を決めれば良い。

#### 〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明によれば、パターンマッチングにより充分な確度のもとでの指紋照合を行なうことができるから、従来技術の問題点に充分に対処し、簡単な構成で指紋照合が可能になり、身元確認などに容易に適用することができる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1団は本発明による指紋照合方法の一実施例:

11, 512)、同一の処理をする。

照合位置としてすべての位置をテストし、不一 致のみしか検出できなかつた場合、検査指紋は登 様指紋と異ると判定される。

このときでの粗照合のテンプレートの移動の様子 (経路) の一例を第14図の(a)、(b) に示す。

和照合で交点数が一定値TH,以下の場合は(S4での結果がyes)、相照合が一致したとし、精照合に進み、一致領域の大きさを求める・ 特照合(S5ないしS8)は、和照合に対し順次 照合領域の大きさを拡大して交点画素数を計算し、 この値がある一定値、TH。を越えたときの照合 領域の大きさを、その照合位置での一致領域の大きさとする(S9、S10)・

全体の判定処理としては、さらに照合位置を1 画索づつずらせた場合の一致領域の大きさの変化 を調べ、その最大のものを検査指紋と登録指紋の 一致領域の大きさとするようになつている。

照合領域の拡大の一例を第15図に示す。

を示すプロツク図、第2図は函像データ細線化の 説明図、第3図は細線化による許容幅の説明図、 第4図はパターンマツチングの説明図、第5図は パターンマツチング判定の説明図、第6図、第7 図、第8図はそれぞれ光学系の説明図、第9図は テンプレートの説明図、第10図は本発明の一実 施例における動作説明用のフローチャート、第11 図はデータ変換の説明図、第12図は交点検出の 説明図、第13図は粗照合用小領域の説明図、第 1 4 図は相照合用テンプレートの移動経路の説明 図、第15図は精照合領域拡大経路の説明図、第 16図は指紋照合システムの従来例を示すプロツ ク図、第17図は特徴点抽出の説明図、第18図 は照合処理説明用のフローチャート、第19図は 特徴点の説明図、第20図は特徴点の位置の差の 説明図、第21図は指紋読取装置の説明図、第22 図はパターンマツチングにおける照合調整の説明 図である。

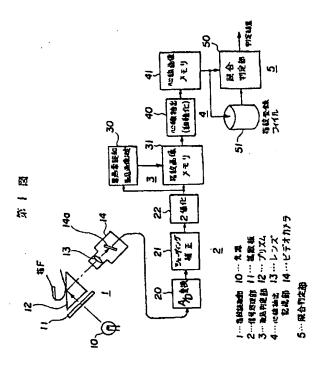
1 ……指紋焼取部、2 ……信号処理部、3 ……取込判定部、4 ……心線抽出紀憶部、5 ……照合

# 特開昭63-132386 (9)

・ 判定部、10……光源、11……拡散板、12… … プリズム、13……レンズ、14……ビデオカメラ・

代理人 弁理士 武 顕次郎 (外 )名)

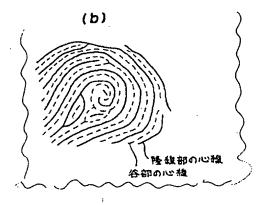




第 2 図

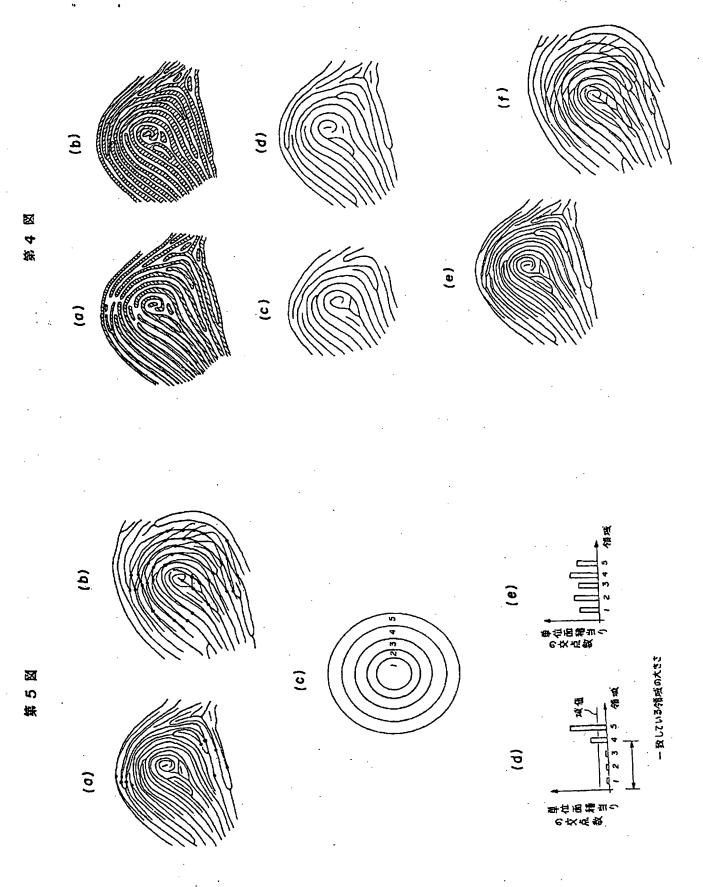
(0)

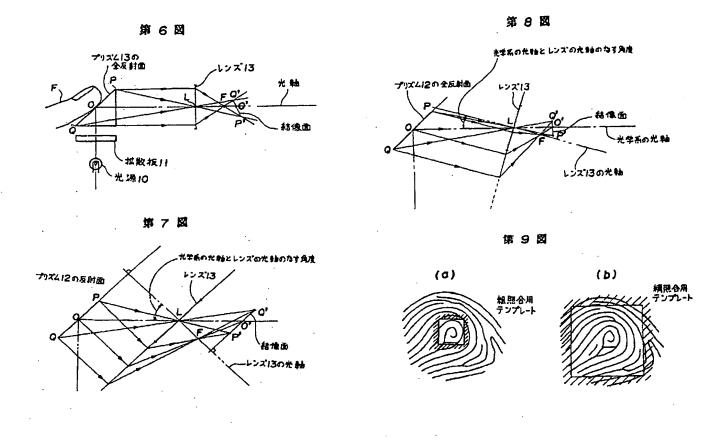


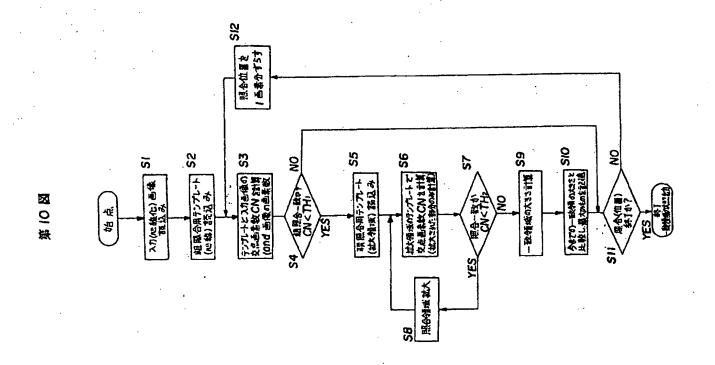


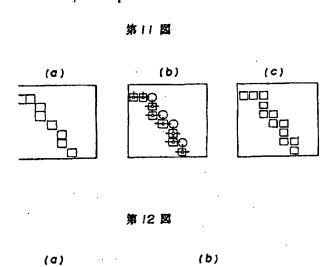
第3図



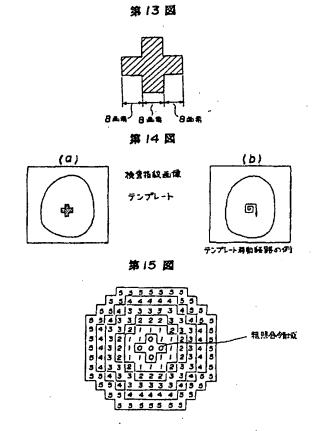


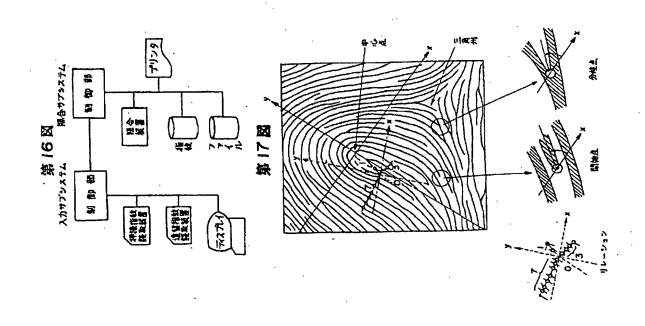


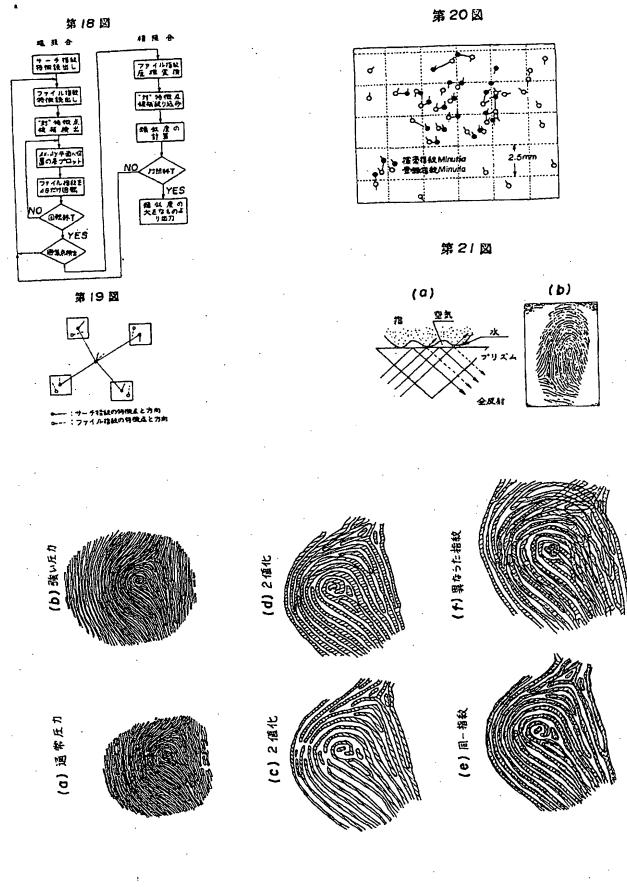




ond で 検出に由素







第22図

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.